

ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ВАЛЕНТНОЙ ЗОНЫ В ДВУМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СИСТЕМАХ

Кибис О. В.

Получены аналитические выражения, определяющие энергетический спектр $2D$ -дырок вблизи вершин подзон при произвольном виде тензора деформации и произвольном виде квантующего потенциала $2D$ -системы. Из анализа полученных выражений следует, что деформация решетки, возникающая в гетероэпитаксиальных системах из-за решеточного несоответствия гетерослоев, оказывает на спектр дырок влияние, сравнимое по величине с влиянием квантующего потенциала, в связи с чем корректный расчет дырочного спектра во многих гетероэпитаксиальных системах требует учета деформации.

Поскольку многие специфические свойства двумерных ($2D$) систем определяются эффектами размерного квантования, большое число теоретических и экспериментальных работ посвящено исследованию энергетического спектра носителей заряда в двумерных подзонах. В последние годы появился ряд теоретических работ [1-4], посвященных исследованию энергетического спектра валентной зоны в деформированных $2D$ -системах. Важность и актуальность такого теоретического исследования определяются тем, что многие реальные $2D$ -системы (пленки на подложках, гетеропереходы) представляют собой контакт материалов с различными периодами решеток и различными коэффициентами термического расширения, в связи с чем эти системы исходно (без приложения внешних механических нагрузок) находятся в деформированном состоянии. Поэтому для интерпретации экспериментальных результатов, полученных при исследовании таких систем, необходимо знать, как изменяется энергетический спектр $2D$ -носителей под действием деформации.

Расчет энергетического спектра валентной зоны в деформированных $2D$ -системах — относительно трудная задача, так как при таком расчете наряду с особенностями конкретной $2D$ -системы необходимо учитывать сложный характер валентной зоны в деформированных полупроводниках. В настоящее время существует два различных подхода к решению этой задачи. Первый состоит в строгом численном расчете спектра дырок с учетом всех особенностей валентной зоны для конкретной $2D$ -системы [2-4]. Достоинством такого подхода является высокая точность полученных результатов, а к недостаткам относится очень большой объем вычислительной работы. Численный расчет не позволяет выяснить общие закономерности квантования валентной зоны, и для ответа на вопрос о характере спектра в другой $2D$ -системе необходимо повторное проведение громоздкой процедуры вычислений при новых значениях параметров. Технические сложности, связанные с реализацией численного расчета, и недостаточно высокая информативность полученных результатов создают серьезные затруднения при анализе экспериментальных данных. Этих недостатков лишен аналитический подход [1]. Суть этого подхода заключается в том, что реальный квантующий потенциал $2D$ -системы аппроксимируется простым модельным потенциалом (бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной ямой), после чего задача определения спектра сводится к решению секулярного уравнения системы дифференциальных уравнений и исследованию асимптотик полученного решения. Асимптотики для энергетического спектра вблизи вершин дв-

рочных подзон представляют собой аналитические выражения, зависящие от ширины потенциальной ямы и параметров энергетического спектра валентной зоны трехмерного кристалла. К достоинствам аналитического подхода относятся сравнительная простота проводимых вычислений и высокая общность полученных результатов, позволяющая с помощью формальной замены параметров в одном и том же аналитическом выражении исследовать квантование валентной зоны в самых различных материалах. Очень часто полученных аналитических выражений для энергетического спектра вблизи вершин подзон оказывается вполне достаточно для анализа экспериментальных данных, так как во многих $2D$ -системах реализуются условия квантового предела, когда дырочный газ заполняет состояния только вблизи вершины первой подзоны. Однако серьезным недостатком этого метода является относительно невысокая точность расчета, обусловленная модельной аппроксимацией квантующего потенциала $2D$ -системы. В связи с этим представляется важным получение аналитических выражений, определяющих энергетический спектр вблизи вершин дырочных подзон в деформированных $2D$ -системах при произвольном виде квантующего потенциала. Решению этой задачи посвящена данная работа.

Будем для определенности рассматривать спектр дырок в $2D$ -системах с ориентацией поверхности (001), так как большая часть известных в настоящее время экспериментальных исследований двумерного дырочного газа проведена для $2D$ -систем именно с такой ориентацией. Отметим также, что все проводимые далее рассуждения достаточно общие и могут быть использованы при расчете дырочного спектра для $2D$ -систем с любой ориентацией. Задача определения спектра дырок в деформированной $2D$ -системе решается в рамках метода эффективной массы и заключается в нахождении собственных значений гамильтониана

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0(u_{ij}, k_x, k_y, \hat{k}_z) + V(z)I, \quad (1)$$

где $V(z)$ — квантующий потенциал $2D$ -системы, а

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_0 = & \left(\gamma_1 + \frac{5}{2} \gamma_2 \right) I \sum_i k_i^2 + \left(a + \frac{5}{4} b \right) I \sum_i u_{ii} - \sum_i J_i^2 (2\gamma_2 k_i^2 + b u_{ii}) - \\ & - \sum_{i \neq j} [J_i J_j] \left(2\gamma_3 k_i k_j + \frac{d}{\sqrt{3}} u_{ij} \right) \end{aligned} \quad (2)$$

есть гамильтониан Латтинжера с деформационным слагаемым Бира—Пикуса, определяющий спектр валентной зоны в деформированных кубических полупроводниках [5]. Здесь u_{ij} — компоненты тензора деформации, $\hat{k}_z = -i \frac{\partial}{\partial z}$ — оператор квантующейся компоненты квазиимпульса, k_x и k_y — компоненты квазиимпульса k , лежащего в плоскости $2D$ -слоя, $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ — параметры Латтинжера валентной зоны трехмерного кристалла, a, b, d — константы деформационного потенциала валентной зоны трехмерного кристалла, I — единичная матрица, J_x, J_y, J_z — матрицы 4×4 , соответствующие моменту $J=3/2$, а суммирование ведется по индексам $i, j=x, y, z$. Гамильтониан (1) можно формально записать в виде суммы двух слагаемых \mathcal{H}' и \mathcal{H}'' , где

$$\mathcal{H}' = \left(\gamma_1 I + \frac{5}{2} \gamma_2 I - 2\gamma_2 J_z^2 \right) \hat{k}_z^2 + \frac{b}{2} \left(\frac{5}{4} I - J_z^2 \right) (2u_{zz} - u_{xx} - u_{yy}) + V(z)I, \quad \mathcal{H}'' = \mathcal{H} - \mathcal{H}'. \quad (3)$$

В базисе функций с определенной проекцией момента J на ось квантования z матрица гамильтониана \mathcal{H}' принимает диагональный вид и его собственные функции есть

$$\begin{aligned} & \left\| \begin{array}{c} \psi_{h_n} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right\|, & \left\| \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \psi_{h_n} \end{array} \right\|, & \left\| \begin{array}{c} 0 \\ \psi_{l_n} \\ 0 \\ 0 \end{array} \right\|, & \left\| \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \psi_{l_n} \\ 0 \end{array} \right\|, \end{aligned}$$

а собственные значения ε' гамильтониана \mathcal{H}_0' определяются обычными уравнениями Шредингера

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_h \psi_{hn} &= \varepsilon'_{hn} \psi_{hn}, & \mathcal{H}_l \psi_{ln} &= \varepsilon'_{ln} \psi_{ln}, \\ \mathcal{H}_h &= -(\gamma_1 - 2\gamma_2) \frac{d^2}{dz^2} + \varepsilon_u + V(z), \\ \mathcal{H}_l &= -(\gamma_1 + 2\gamma_2) \frac{d^2}{dz^2} - \varepsilon_u + V(z),\end{aligned}\quad (4)$$

где

$$\begin{aligned}\varepsilon_u &= \frac{b}{2} (u_{xx} + u_{yy} - 2u_{zz}), \\ \varepsilon'_{hn} &= \varepsilon_{hn}(0) + \varepsilon_u, \\ \varepsilon'_{ln} &= \varepsilon_{ln}(0) - \varepsilon_u,\end{aligned}\quad (5)$$

$n=1, 2, 3, \dots$, а $\varepsilon_{hn}(0)$ ($\varepsilon_{ln}(0)$) — энергия подзон тяжелых (легких) дырок в недеформированной $2D$ -системе при $\mathbf{k}=0$. В дальнейшем ветви энергетического спектра дырок будем обозначать символами hn, ln , показывающими, в какой уровень энергии $\varepsilon_{hn}(0)$, $\varepsilon_{ln}(0)$ переходит данная ветвь при $\mathbf{k}=0$ и отсутствии деформации. При произвольной деформации, вообще говоря, $\varepsilon'_{hn} \neq \varepsilon'_{ln}$ и каждый уровень энергии гамильтониана \mathcal{H}_0' вырожден двукратно, что соответствует Крамерсову вырождению подзон при $\mathbf{k}=0$. При расчете спектра вблизи вершин подзон будем рассматривать гамильтониан \mathcal{H}_0'' как возмущение и, учитывая двукратное вырождение уровней энергии «невозмущенного» гамильтониана \mathcal{H}_0' , воспользуемся известной теорией возмущений для вырожденного спектра. Во втором порядке теории возмущений энергетический спектр дырок в подзоне hn определяется выражением

$$\begin{aligned}\varepsilon_{hn}(\mathbf{k}) &= \varepsilon_{hn}(0) + a(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) + \frac{b}{2}(u_{xx} + u_{yy} - 2u_{zz}) + \frac{\hbar^2}{2m_{hn}}(k_x^2 + k_y^2) + \\ &+ \left[\left(\sqrt{3} \gamma_2 (k_x^2 - k_y^2) + \frac{\sqrt{3}}{2} b(u_{xx} - u_{yy}) \right)^2 + d^2(u_x^2 + u_y^2) + (2\sqrt{3} \gamma_3 k_x k_y + d u_{xy})^2 \right] B_{hn} \pm \\ &\pm 4\sqrt{3} \gamma_3 C_{hn} \left[d^2(k_x u_{yz} - k_y u_{xz})^2 + (k_x^2 + k_y^2) \left\{ \left(\sqrt{3} \gamma_2 (k_x^2 - k_y^2) + \frac{\sqrt{3}}{2} b(u_{xx} - u_{yy}) \right)^2 + \right. \right. \\ &\left. \left. + (2\sqrt{3} \gamma_3 k_x k_y + d u_{xy})^2 \right\} \right]^{1/2},\end{aligned}\quad (6)$$

где эффективная масса дырок в подзоне hn определяется соотношением

$$\frac{\hbar^2}{2m_{hn}} = \gamma_1 + \gamma_2 + 12\gamma_3^2 \sum_m \frac{|\langle \psi_{hn} | \hat{k}_x | \psi_{lm} \rangle|^2}{\Delta \varepsilon_{nm}}, \quad (7)$$

а параметры двумерного спектра дырок

$$\begin{aligned}B_{hn} &= \sum_m \frac{|\langle \psi_{hn} | \psi_{lm} \rangle|^2}{\Delta \varepsilon_{nm}}, \\ C_{hn} &= \sum_{n_i} \frac{i \langle \psi_{hn} | \hat{k}_x | \psi_{lm} \rangle \langle \psi_{lm} | \psi_{hn} \rangle}{\Delta \varepsilon_{nm}}, \\ \Delta \varepsilon_{nm} &= \varepsilon'_{hn} - \varepsilon'_{lm} = \varepsilon_{hn}(0) - \varepsilon_{lm}(0) + 2\varepsilon_u.\end{aligned}\quad (8)$$

Границы применимости выражения (6) определяются обычным критерием применимости теории возмущений $|\mathcal{H}_{nm}''/\Delta \varepsilon_{nm}| \ll 1$, который при явной форме записи матрицы \mathcal{H}_{nm}'' принимает вид

$$\begin{aligned}\left| \frac{2\sqrt{3} \gamma_3 (k_y + i k_x) \langle \psi_{hn} | \hat{k}_x | \psi_{lm} \rangle + d(u_{yz} + i u_{xz}) \langle \psi_{hn} | \psi_{lm} \rangle}{\Delta \varepsilon_{nm}} \right| &\ll 1, \\ \left| \frac{\left(\sqrt{3} \gamma_2 (k_x^2 - k_y^2) - 2i \sqrt{3} \gamma_3 k_x k_y + \frac{\sqrt{3}}{2} b(u_{xx} - u_{yy}) - i d u_{xy} \right) \langle \psi_{hn} | \psi_{lm} \rangle}{\Delta \varepsilon_{nm}} \right| &\ll 1.\end{aligned}\quad (9)$$

Знаки « \pm » в (6) соответствуют двум ветвям подзоны hn расщепленной по спину при $k \neq 0$. Из (6) непосредственно следует, что расщепление подзон при $k \neq 0$ имеет место лишь для несимметричного квантующего потенциала $V(z) \neq V(-z)$. Это связано с тем, что для симметричного потенциала волновые функции $\psi_{ln}(z)$, $\psi_{lm}(z)$ обладают определенной четностью и $C_{ln} = 0$, так как при одинаковой четности $\psi_{ln}(z)$ и $\psi_{lm}(z)$ матричный элемент $\langle \psi_{ln} | \hat{k}_z | \psi_{lm} \rangle = 0$, а при разной четности $\langle \psi_{ln} | \psi_{lm} \rangle = 0$. Отметим, что в недеформированной системе величина спинового расщепления подзоны $\sim k^3$, тогда как механические напряжения, которым соответствуют значения компонент тензора деформации $u_{xx} - u_{yy} \neq 0$, $u_{xz} \neq 0$, $u_{yz} \neq 0$, $u_{xy} \neq 0$, приводят к появлению в (6) линейных по k членов. Наибольший интерес представляет анализ энергетического спектра при деформации, возникающей в гетероэпитаксиальных $2D$ -системах из-за решеточного несоответствия гетерослоев. Для гетероструктур, изготовленных из полупроводниковых материалов $A^{III}B^V$, такая деформация соответствует изотропному в плоскости $2D$ -слоя сжатию или растяжению и описывается диагональным в главных кристаллографических осях тензором с отличными от нуля компонентами u_{zz} и $u_{xx} = u_{yy}$. Для описания такой деформации удобно ввести параметр $u_0 = u_{zz} - u_{xx} = u_{zz} - u_{yy}$ ($u_0 > 0$ соответствует сжатию в плоскости $2D$ -слоя, $u_0 < 0$ — растяжению). Необходимо подчеркнуть, что разбиение гамильтониана (1) на сумму \mathcal{H}' и \mathcal{H}'' было проведено таким образом, чтобы при изотропном в плоскости $2D$ -слоя сжатии (растяжении) матричные элементы \mathcal{H}_{nm}'' не содержали деформационных членов, в связи с чем критерий (9) не требует малости деформации u_0 , т. е. при любой деформации u_0 (когда $\Delta \epsilon_{nm} \neq 0$) имеется область вблизи $k=0$, где выполняется условие (9) и соответственно применимо выражение (6) для энергетического спектра дырок. При некоторых значениях u_0 имеем $\Delta \epsilon_{nm} = 0$, что соответствует касанию подзон hn и lm в точке $k=0$, т. е. при этом касании уровень энергии $\epsilon'_{hn} = \epsilon'_{lm}$ гамильтониана вырожден четырехкратно (случайное вырождение, не связанное с симметрией системы). Обобщая вышесказанные рассуждения на случай четырехкратного вырождения уровней энергии невозмущенного гамильтониана \mathcal{H}' , получим выражение для энергетического спектра подзон hn и lm вблизи точки касания

$$\epsilon(k) = \pm \beta_{nm} k, \quad (10)$$

где $\beta_{nm} = 2\sqrt{3}\gamma_3 | \langle \psi_{hn} | \hat{k}_z | \psi_{lm} \rangle |$. Отсюда следует, что касание подзон может приводить к появлению в энергетическом спектре линейных по k членов. Согласно (10), при отсутствии центра инверсии у квантующего потенциала $V(z)$ линейные члены появляются при касании любых двух подзон hn и lm , а в случае симметричного потенциала $V(z)$ линейные по k члены появляются при касании подзон hn и lm с номерами n и m , обладающими различной четностью. Выражения (6)—(10) были получены для подзоны hn . Аналогичные выражения для lm получаются из (6)—(10) формальной заменой $h \leftrightarrow l$, $\gamma_2 \rightarrow -\gamma_2$, $b \rightarrow -b$.

В реальных $2D$ -системах характерное расстояние между первыми дырочными подзонами при отсутствии деформации составляет величину ≤ 10 мэВ, а константа деформационного потенциала $b \sim 1$ эВ. Поэтому уже $u_0 \sim 10^{-3}$ приводит к изменению межподзонного расстояния того же порядка, что и само расстояние, в связи с чем параметры спектра (7), (8) испытывают заметное изменение по сравнению со своими значениями в недеформированной $2D$ -системе. В частности, при произвольном виде $V(z)$ сохраняет свою силу вывод о возможности смены знака эффективной массы (7), сделанный в [1] при анализе квантования в модели бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной ямы. Даже для хорошо согласованных по параметрам решетки гетероструктур GaAs—Al_xGa_{1-x}As несоответствие периодов решеток составляет $\sim 10^{-3}$, что приводит к возникновению деформации $u_0 \sim 10^{-3}$ [6]. Отсюда следует, что корректный расчет спектра дырок в гетероструктурах должен учитывать деформационные эффекты, поскольку деформации $u_0 \sim 10^{-3}$ оказывают на спектр влияние, сравнимое с влиянием квантующего потенциала $2D$ -системы. Во многих $2D$ -системах дырочный газ заполняет состояния только вблизи вершины первой подзоны $h1$. Суммируя полученные результаты, отметим, что деформация $u_0 < 0$

($u_0 > 0$) приводит к уменьшению (увеличению) расстояния между $h1$ и другими подзонами, увеличению (уменьшению) эффективной массы дырок вблизи вершины подзоны $h1$, увеличению (уменьшению) непараболичности подзоны $h1$, увеличению (уменьшению) спинового расщепления подзоны $h1$ в несимметричном потенциале $V(z)$.

При очень больших расстояниях между $h1$ и другими подзонами (больших деформациях сжатия в плоскости $2D$ -слоя) можно пренебречь вкладом в спектр $h1$ матричных элементов \mathcal{H}_{h1}'' , «связывающих» $h1$ с другими подзонами. Согласно (6), (7), энергетический спектр $h1$ при этом будет параболическим, причем величина эффективной массы $\hbar^2/2m_{h1} = \gamma_1 + \gamma_2$ и не зависит от квантующего потенциала. Очень большие деформации сжатия $u_0 \sim 10^{-2}$ возникают в слоях $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ в гетероструктурах $\text{GaAs}-\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ [7]. В работе [8] было обнаружено, что эффективная масса дырок в гетероструктуре $\text{GaAs}-\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{As}$ есть $m_h^*/m_0 = 0.14$. Сравнивая эту величину с эффективной массой тяжелых дырок $\frac{m_h}{m_0} = \frac{\hbar^2}{2n_0} \frac{1}{\gamma_1 - 2\gamma_2} = 0.35$ и эффективной массой легких дырок $\frac{m_l}{m_j} = \frac{\hbar^2}{2m_0} \times$

$\times \frac{1}{\gamma_1 + 2\gamma_2} = 0.09$ в трехмерном кристалле $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{As}$, авторы [8] предположили, что под действием деформации решеточного несоответствия первая подзона («тяжелых» дырок $h1$) и вторая подзона («легких» дырок $l1$) меняются местами, в результате чего во всех процессах участвуют легкие дырки. Из проведенного выше анализа следует, что под действием деформации сжатия происходит не смена типа первой подзоны, а, напротив, увеличение расстояния между подзоной $h1$ и другими подзонами, сопровождающееся уменьшением эффективной массы m_{h1} . Благодаря очень большим деформациям сжатия, реализующимся в рассматриваемой гетеросистеме, можно положить $\frac{m_{h1}}{m_0} \approx \frac{\hbar^2}{2m_0} \frac{1}{\gamma_1 + \gamma_2} = 0.11$, что находится в разумном соответствии с экспериментально наблюдавшимся значением эффективной массы. Большие механические напряжения сжатия возникают также в слоях кремния на сапфире [9]. Пленки кремния с ориентацией (001) выращивают на подложках сапфира (Al_2O_3) с ориентацией $(\bar{1}012)$. Особенностью этой эпитаксиальной системы является то обстоятельство, что коэффициент термического расширения кремния изотропен в плоскости (001), тогда как коэффициент термического расширения Al_2O_3 обладает анизотропией в плоскости $(\bar{1}012)$. Это приводит к возникновению деформации слоя кремния вида

$$u_{xx} = u_{yy} \neq 0, \quad u_{zz} \neq 0, \quad u_{xy} = u_{xz} = u_{yz} = 0,$$

где

$$x \parallel [100] \text{ Si} \parallel [10\bar{1}1] \text{ Al}_2\text{O}_3, \quad y \parallel [010] \text{ Si} \parallel [\bar{1}210] \text{ Al}_2\text{O}_3.$$

Согласно (6), наличие указанной деформации приводит к появлению линейных по k членов в законе дисперсии $2D$ -дырок. В связи с этим интересно рассмотреть результаты экспериментов [10], где исследовалось спиновое расщепление дырочных подзон при $k \neq 0$ в инверсионных каналах на поверхности кремния, выращенного на сапфире. Проведенный в [11] анализ экспериментальных данных [10] показал, что хорошее согласие с экспериментом можно получить, если предположить наличие в спектре подзоны $h1$ линейных по k членов: $\epsilon_{h1}(k) = Ak^2 \pm ak$, где величина линейных членов $a \approx 3 \cdot 10^{-10}$ эВ·см. Авторы [11] предположили, что возникновение линейных членов в законе дисперсии дырок обусловлено нарушением приближения эффективной массы вблизи резкой границы $\text{Si}-\text{SiO}_2$. Если же предположить, что возникновение линейных членов обусловлено деформацией, то, согласно (6),

$$\alpha = 6\gamma_3 b (u_{xx} - u_{yy}) \sum_m \frac{i \langle \psi_{h1} | \hat{k}_x | \psi_{lm} \rangle \langle \psi_{lm} | \psi_{h1} \rangle}{\Delta \epsilon_{lm}}. \quad (11)$$

Типичное расстояние между первыми дырочными подзонами в инверсионных каналах на поверхности кремния ~ 10 мэВ, матричный элемент $\langle \psi_{h1} | \hat{k}_x | \psi_{lm} \rangle \sim \sim 1/d$, где $d \sim 50$ Å — характерная толщина инверсионного канала, а дефор-

мадия $u_{xx} - u_{yy} \approx 0.6 \cdot 10^{-3}$ [9], что дает значение $\alpha \sim 10^{-10}$ эВ·см. Таким образом, учет деформации кремния на сапфире дает величину линейных по k членов, согласующуюся с определенной из эксперимента. Изучение свойств $2D$ -дырок в слоях кремния на сапфире было продолжено в работе [12], где в полном соответствии с рассматриваемой теорией наблюдались уменьшение эффективной массы и уменьшение непараболичности первой подзоны по сравнению с результатами аналогичных исследований в обычных МДП структурах.

Полученные в настоящей работе выражения позволяют исследовать изменение дырочного спектра под действием деформации при наиболее общем виде квантующего потенциала $V(z)$. Для нахождения уровней энергии $\varepsilon_{jn}(0)$ и волновых функций $\psi_{jn}(z)$ ($j=h, l$), определяющих параметры спектра (7), (8), необходимо решить обычные уравнения Шредингера (4), что, конечно же, легче, нежели точное решение системы уравнений эффективной массы с гамильтонианом (1). Так, например, при аппроксимации $V(z)$ бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной ямой получаем из (4)

$$\varepsilon_{hn}(0) = \frac{(\gamma_1 - 2\gamma_2) \pi^2 n^2}{L^2}, \quad \varepsilon_{ln}(0) = \frac{(\gamma_1 + 2\gamma_2) \pi^2 n^2}{L^2}, \quad \psi_{hn}(z) = \psi_{ln}(z) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi n z}{L}\right).$$

После подстановки этих уровней энергии и волновых функций в (7), (8) выражение для спектра (6) становится адекватным ранее полученным асимптотикам точного решения системы уравнений эффективной массы в модели бесконечно глубокой ямы [1]. Полученные в настоящей работе соотношения могут быть использованы для анализа экспериментальных фактов и при отсутствии точной информации о виде потенциала $V(z)$, когда нельзя решить уравнения (4). При этом параметры $2D$ -спектра дырок (7), (8) должны определяться из эксперимента аналогично тому, как определяются из эксперимента параметры валентной зоны трехмерных полупроводниковых кристаллов.

Список литературы

- [1] Кябис О. В., Шварцман Л. Д. // Поверхность. Физика, химия, механика. 1985. № 7. С. 119—123.
- [2] Sanders G. D., Chang Y. C. // Phys. Rev. B. 1985. V. 32. N 6. P. 4282—4285.
- [3] Andreani L. C., Pasquarello A., Bassani F. // Phys. Rev. B. 1987. V. 36. B 11. P. 5887—5894.
- [4] Platero G., Altarelli M. // Phys. Rev. B. 1987. V. 36. N 12. P. 6591—6595.
- [5] Бир Г. Л., Пикус Г. Е. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках. М., 1972. 584 с.
- [6] Кейси Х., Паниш М. Лазеры на гетероструктурах. Т. 2. Материалы. Рабочие характеристики. М., 1981. 354 с.
- [7] Osborn G. C. // Phys. Rev. B. 1983. V. 27. N 8. P. 5126—5128.
- [8] Schirber J. E., Fritz I. J., Dawson L. R. // Appl. Phys. Lett. 1985. V. 46. N 2. P. 187—189.
- [9] Hughes A. J., Thorsen A. C. // J. Appl. Phys. 1973. V. 44. N 5. P. 2304—2310.
- [10] Gusev G. M., Kvon Z. D., Ovsyuk V. N. // J. Phys. C. 1984. V. 17. N 26. P. L683—L688.
- [11] Бычков Ю. А., Рашба Э. И. // УФН. 1985. Т. 146. В. 3. С. 531—534.
- [12] Гусев Г. М., Квон З. Д., Ольшанецкий Е. Б., Черемных П. А. // ФТТ. 1988. Т. 30. В. 2. С. 368—372.

Новосибирский
электротехнический институт

Получена 24.06.1988
Принята к печати 27.12.1988